Beitragsanmeldung zur Konferenz Freiburg 2008

Aufbau eines Messstandes zur Untersuchung von Strahlenschäden durch Röntgenstrahlung für XFEL Pixeldetektoren — •Hanno Perrey[1], Friederike Januschek[1,2], Robert Klanner[1], Eckhart Fretwurst[1] und Fabian Renn[3] — [1]Institut für Experimentalphysik, Uni Hamburg — [2]DESY, Hamburg — [3]Sommerstudent am DESY, Uni Heidelberg

Wenn der Röntgenlaser XFEL am Deutschen Elektronensynchrotron (DESY) ab 2013 in Betrieb geht, werden die geplanten Silizium-Pixeldetektoren einem Fluss von 10^{16} Photonen/cm^2 von 12 keV ausgesetzt, was einer Oberflächendosis von etwa 1 GGy entspricht.

In diesem Vortrag wird der Aufbau eines Messstandes im F3-Strahl am Speicherring DORIS beschrieben und die ersten Ergebnisse von Bestrahlungen von Teststrukturen vorgestellt.

Part: T
Type: Vortrag;Talk
Topic: 3.2 Halbleiterdetektoren
Email: hanno.perrey@desy.de